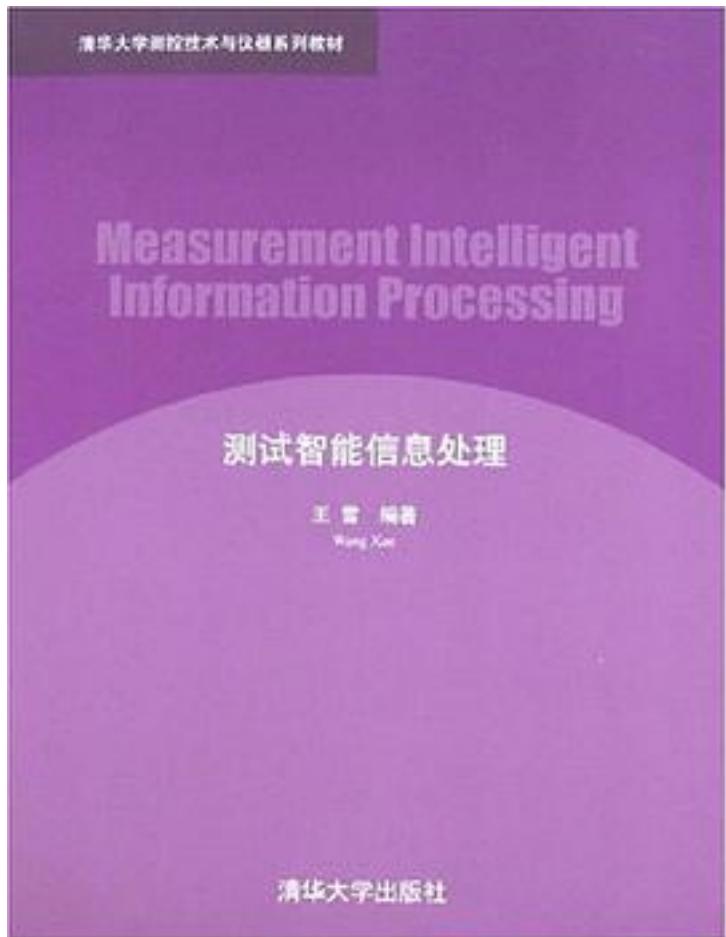


测试智能信息处理



[测试智能信息处理_下载链接1](#)

著者:王雪

出版者:

出版时间:2008-1

装帧:

isbn:9787302165750

《清华大学测控技术与仪器系列教材·测试智能信息处理》介绍了测试系统的组成、特点以及信号测量处理的过程，给出了数据融合的基本方法，重点介绍了测试智能计算的基础理论和方法。具体内容包括测试系统的组成和信息获取的过程、智能计算的产生和

发展、数据融合的基本原理；神经网络计算的基础、神经计算的基本方法、神经计算的实现技术和支持向量机；模糊计算中的模糊逻辑与模糊推理、模糊计算应用和粗糙集；进化计算中的遗传算法、粒群智能、蚁群智能等方法和实例。

智能计算是测试智能信息处理的核心技术，是目前多学科研究和应用的热点，涉及测试技术、电子技术、计算机技术、控制技术等，具有广泛的应用前景。测量技术是信息处理的关键和基础。

作者介绍:

目录:

[测试智能信息处理](#) [下载链接1](#)

标签

评论

[测试智能信息处理](#) [下载链接1](#)

书评

[测试智能信息处理](#) [下载链接1](#)